

El Instituto se encuentra ubicado en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de La Cartuja de Sevilla. La dirección postal completa es Avda. Américo Vespucio nº 49, Isla de la Cartuja (41092-Sevilla).



Para llegar al Instituto pueden utilizarse, además de taxis, las líneas de autobuses urbanos circulares C-1 y C-2 que tienen paradas delante del edificio. Estas mismas líneas paran también en la estación de Santa Justa de RENFE por lo que es una buena combinación si llega a Sevilla en AVE. Si desea venir andando desde la zona centro debe hacerlo por el puente de La Barqueta, estando a unos 45 minutos del centro de la ciudad.

Patrocinadores



Este curso de postgrado pretende familiarizar a los asistentes con algunos de los métodos físicos de análisis más utilizados en la actualidad para la caracterización de materiales, en especial de aquellos que están constituidos por capas finas, y de sus superficies. El curso, de carácter intensivo y cinco días de duración, consta de clases teóricas y sesiones prácticas. Estas últimas se desarrollarán con grupos reducidos de alumnos, empleándose para ellos el equipamiento científico disponible en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y el Centro Nacional de Aceleradores.

El contenido y enfoque de los temas y otras actividades del curso son eminentemente prácticos, estando dirigido a científicos e ingenieros especializados en temas de análisis, diagnóstico, investigación en superficies, etc. También se considera especialmente adecuado para alumnos de tercer ciclo relacionados con la temática tratada.

Director

Dr. Juan Pedro Espinós Manzorro

Secretaría

Dª. Margarita Adorna Muñoz
D. José Carlos Rivero

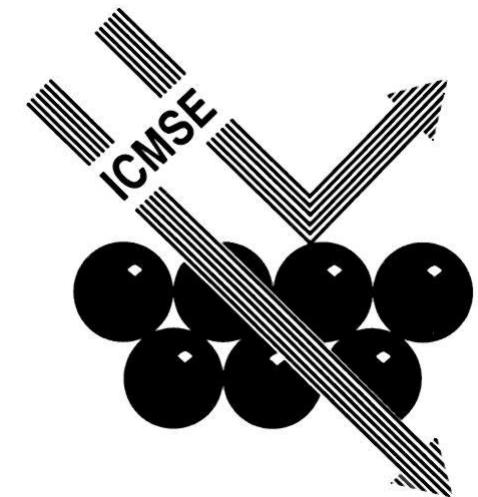
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES

Tfno.: 954489527 – Fax: 954460165
C/ Américo Vespucio, 49 – 41092 SEVILLA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 500 Euros
e-mail: marga@icmse.csic.es

(Los estudiantes universitarios de 3º ciclo y excepcionalmente de 2º ciclo que soliciten beca de inscripción deberán presentar currículum vitae y una carta de presentación de un investigador cualificado)

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES
(CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS "ISLA DE LA CARTUJA")
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
JUNTA DE ANDALUCÍA



MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SÓLIDOS

Curso de Postgrado

<http://www.icms.us-csic.es/capasfinas>

Sevilla, del 20 al 24 de Junio de 2022

Lunes, CLASES TEÓRICAS

20 de junio

INTERACCIÓN DE FOTONES, ELECTRÓNESES IONES CON LA MATERIA CONDENSADA. MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SOLIDOS. Dra. Asunción Fernández

ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISIÓN DE RAYOS X: COMPOSICIÓN SUPERFICIAL.

Dr. Juan Pedro Espinós

ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISIÓN DE RAYOS X: ESTADO QUÍMICO EN LA SUPERFICIE DE SÓLIDOS. Dr. Agustín R. González-Elipe

PÉRDIDA DE ENERGÍA DE ELECTRÓNESES EN SUPERFICIES: PERFILES DE COMPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN ÓPTICA EN EL EUV. Dr. Francisco Yubero

CARACTERIZACIÓN ÓPTICA Y VIBRACIONAL: UV-VISIBLE, ELIPSOMETRÍA Y COLOR.

Dr. Francisco Yubero Valencia

Martes, CLASES TEÓRICAS

21 de junio

MICROSCOPIA DE EFECTO TUNEL.

Dr. Juan Ramón Sánchez

PLASMAS EN LA TECNOLOGÍA DE PELÍCULAS DELGADAS. Dr. José Cotrino

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN Y BARRIDO: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES GENERALES. Dra. Asunción Fernández

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO.

Dra. Mª Carmen Jiménez

ESPECTROSCOPIAS ELECTRÓNICAS: X-EDS y EELS. IMÁGENES FILTRADAS EN ENERGÍA (EFTEM). Dra. Cristina Rojas

NANOMANIPULACIÓN, PROCESADO Y ANÁLISIS DE PROPIEDADES EN EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO. Dra. Ana Borrás.

Miércoles, CLASES TEÓRICAS

22 de junio

ANÁLISIS TRIBOLÓGICO Y MECÁNICO DE CAPAS DELGADAS. Dr. Juan Carlos Sánchez

DIFRACCIÓN y REFLECTOMETRÍA DE RAYOS X DE PELÍCULAS DELGADAS. Dr. José Mª Martínez

MICROSCOPÍAS DE FUERZAS ATÓMICAS. Dra. Carmen López

CARACTERIZACIÓN ÓPTICA Y VIBRACIONAL DE PELÍCULAS DELGADAS: FLUORESCENCIA, INFRARROJO Y RAMAN. Dr. Angel Barranco.

LA ABSORCIÓN DE RAYOS X, EXAFS Y XANES, DE PELÍCULAS DELGADAS. Dr. Juan Pedro Holgado.

RETRODISPERSIÓN RUTHERFORD: PERFILES DE COMPOSICIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS.

Dr. Javier Ferrer

jueves y viernes: PRÁCTICAS 23 y 24 de junio

A. MICROSCOPÍAS ELECTRÓNICAS DE TRANSMISIÓN Y BARRIDO.

Dra. Cristina Rojas, Dra. Mª Carmen Jiménez, Lda. Olga Montes

B. ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISIÓN, XPS.

Dr. Juan Pedro Espinós, Dra. Florencia Vattier.

C. DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

Dr. José Mª Martínez

D. RETRODISPERSIÓN RUTHERFORD.

Dr. Javier Ferrer

E. MICROSCOPÍA DE FUERZAS ATÓMICAS.

Dra. Carmen López, Dr. Juan Ramón Sánchez

F. ABSORCIÓN DE RAYOS X, EXAFS Y XANES

Dr. Juan Pedro Holgado.

BOLETIN DE INSCRIPCION

MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SÓLIDOS

D. Teléfono

Titulación y Profesión

Centro de Procedencia:

Dirección

Email.....

desea inscribirse en el Curso "MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SÓLIDOS", que se celebrará durante los días del 20 al 24 de Junio de 2022

Forma de pago:

Ingreso o transferencia a la cuenta bancaria
IBAN=ES2300494510312910002156 del Banco
Santander, a favor del CSIC (CIC-Cartuja)
indicando en observaciones el nombre del
solicitante y del Curso

Referencia (Adjuntar copia)

Solicita beca como estudiante y adjunta un
"curriculum vitae" y una carta de presentación de
un investigador cualificado.

FIRMA:

Plazo límite de inscripción: **10 de junio de 2022**

Cuota de inscripción: 500 Euros